

Mikroskopie atomárních sil (AFM) je široce využívanou metodou pozorování povrchové struktury látek. Získávání informací o reliéfu je uskutečňováno pomocí velmi ostrého hrotu upevněného na ohebném držáku. Tím přejíždíme po povrchu a snímáme jeho ohnutí za pomoci odrazu laserového paprsku. Hrot se ovšem tímto procesem opotřebovává, tupí a znečišťuje. Práce se zabývá možností opravy hrotů, které mají stále ještě funkční držáky. Při práci byla využita technika fokusovaného iontového svazku (FIB) a soustava plynných prekurzorů (GIS), které jsou zabudovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu (SEM). Byly zkoumány různé postupy a parametry iontového obrábění a depozice. Upravené hroty byly testovány pomocí AFM na pracovišti KFPP.